PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-330715

(43)Date of publication of application: 18.11.1992

(51)Int.CI. H01L 21/027

(21)Application number: 03-020292 (71)Applicant: OKI ELECTRIC IND CO LTD

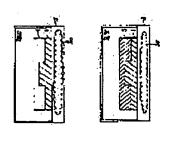
(22)Date of filing: 22.01.1991 (72)Inventor: UESUGI TAKESHI

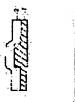
(54) FLATTENING METHOD OF RESIST

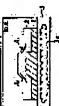
(57)Abstract:

PURPOSE: To form an excellent, hardened and flattened film by a method wherein a substrate provided with a difference in level is coated with a resin whose thermally melting property is large, the resin is baked under pressurization and flattened, the flattened film is baked under a vacuum.

CONSTITUTION: A resin whose thermally siting property is large is turned on a substrate 1 provided with a difference in level; a coating film 2 is formed. The substrate 1 on which the coating film 2 has been formed and which is provided with the difference in level is inserted into a hermetically sealed baking furnace 3. In a state that the inside of the baking furnace 3 has been pressurized to, e.g. 5 atm., a baking operation is performed at 200° C for one minute by using a heater 3a. Thereby, the resin film 2 on the substrate 1 provided with the difference in level is changed to a well flattened film 4. When the flattened film 4 is used as a lower-layer film in a







multilayer resist process, a baking operation is performed at 200° C for five minutes by using the heater 3a while the inside of the hermetically sealed baking furnace 3 is set to a vacuum. Thereby, the generation of CO2 and H2O in a gaseous form is promoted from the resin, a thermal crosslinking operation is promoted, and it is possible to obtain a thermally hardened and well flattened film 5 faster than in an open baking furnace.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-330715

(43)公開日 平成4年(1992)11月18日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 21/027

7352-4M

H01L 21/30

361 X

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

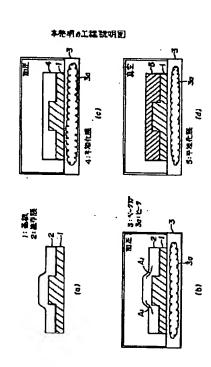
(21)出願番号	特顧平3-20292	(71)出願人 000000295
(22) 出願日	平成3年(1991)1月22日	沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
		(72)発明者 上杉 毅
		東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電
		工業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 菊池 弘

(54) 【発明の名称】 レジスト平坦化方法

(57)【要約】

【目的】 段差を有する基板上の塗布膜を速く熱硬化 し、良好な平坦化膜を形成することができるレジスト平 坦化方法を提供することを目的とする。

【構成】 段差を有する基板上に熱溶融性の大きい樹脂を回転塗布して塗布膜を形成し、密閉されたペーク炉内において、加圧下でペークを行い、塗布膜を平坦化し、次いで、真空下でペークを行って急速に熱硬化させるようにしたものである。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 段差を有する基板上に、熱溶融性の大き い樹脂を塗布して塗布膜を形成する工程と、上配基板 を、密閉したペーク炉内に挿入して加圧下でペークを行 うことにより、上記塗布膜の平坦化膜を形成する工程 と、密閉されたペーク炉内において、真空下でペークを 行うことにより、上配平坦化膜を急速に熱硬化させる工 程と、よりなるレジスト平坦化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、段差を有する基板を 良好に平坦化できるようにしたレジスト平坦化方法に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体装置の高集積化の要求が益 々高まってきており、これにともない、微細パターン形 成に関する技術的要請も益々厳しいものとなってきてい る。

【0003】特に、段差を有する基板上での微細パター ン形成には、多層レジストプロセスが有利であり、これ 20 に用いる下層膜は平坦化の役目および基板のエッチング マスクとしての役目を担う。

【0004】多層レジストプロセスの下層膜平坦化に関 しては、例えば、「Novolac ResinPlanarization Layer s for Multilayer Resist Imaging Systems」(ノボラ ックレジン プラナリゼーション フォ マルチレイヤ レジスト イメージングシステム) . J. Electrochem. Soc, Ud 133, No. 11, 1986, P2394~2398 T. R Pampa! one 等に開示されるものがある。

【0005】この文献によれば、〇-クレゾールノポラ 30 ック(以下、O-CNと略す)のごとき、低温で熱溶融 し、高温で熱架橋を開始する樹脂を用い、大気中で〇一 CNの熱溶融温度でのペークと熱架橋温度でのペークと いった2段階ペークプロセスにより、段差を有する基板 を平坦化する下層膜を形成するというものであった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、以上述べた大 気中での2段階ペークプロセスによる平坦化方法では、 最適な平坦化に寄与する熱溶融温度が存在するものの、 ら、実際には、同時に熱架橋も開始している。

【0007】このため、段差を有する基板上において、 平坦化を向上させる熱溶融と、平坦化を抑制する熱架橋 といった競争反力が起こっており、十分に熱溶融性を大 きくすることができないため、十分な平坦化を行うこと ができなかった。

【0008】この発明は前紀従来技術が持っている問題 点のうち、平坦化を向上させる熱溶融と平坦化を抑制す る熱架橋といった競争反力が同時に起こる点について解 決したレジスト平坦化方法を提供するものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】この発明は前記問題点を 解決するために、レジスト平坦化方法において、段差を 有する基板上に熱溶融性の大きい樹脂を塗布して形成し た盤布膜を密閉されたペーク炉内において加圧下でペー クを行って平坦化膜を形成する工程と、この平坦化膜を 真空下でペークすることにより急速に熱硬化させる工程 とを導入したものである。

[0010]

10 【作用】この発明によれば、レジスト平坦化方法におい て、以上のような工程を導入したので、段差を有する基 板上に熱溶融性の大きい樹脂を塗布して塗布膜を形成し て、密閉してペーク炉内で加圧してペークすることによ り、塗布膜の平坦化が促進され、この平坦化膜を真空下 でペークすることにより、樹脂から発生するガスを促進 させ、熱架橋反応を促進することになり、その結果、平 坦化膜を硬化させ、すぐれた平坦化膜を形成し、したが って、前配問題点が除去できる。

[0011]

【実施例】以下、この発明のレジスト平坦化方法の実施 例について図面に基づき説明する。図1(a) ないし図1 (d) はその一実施例を説明するための工程説明図であ る.

【0012】まず、図1(a) に示すように、段差を有す る基板1上に、O-CNのごとき、熱溶融性の大きい樹 脂を回転して、銘布膜2を形成する。

【0013】この塗布膜2を形成した段差を有する基板 1を図1(b) に示すように、密閉されたペーク炉3内に 挿入し、このペーク炉3内を例えば、5.0気圧に加圧し た状態で、ヒータ3aにより、200℃1分のペークを 行う。

【0014】通常のオープンペーク炉であれば、例え ば、O-CNは200℃での加熱では、熱溶融反応と、 熱架橋反応といった平坦化を促進させる反応と、平坦化 を抑制させる反応が競争的に起こっており、この熱架橋 反応のために、樹脂自身の粘性を十分に下げることがで きず、結果として、十分な平坦化が行えない。

【0015】ところが、図1(b) のように、ペーク炉3 内において、加圧下でペークを行った結果、樹脂自身の その温度で長時間ペークを行うと、熱硬化することか 40 粘性を十分に下げることができ、段差凸部の樹脂が矢印 A1で示すように、凹部へとフローする。したがって、 段差を有する基板 1 上の樹脂膜 2 が図 1 (c) に示すよう に、良好な平坦化膜4となる。

> 【0016】次に、この理由について述べる。通常、樹 脂の熱架橋反応時には、COェやHェOがガス状で発生 すると考えられる。通常のオープンペーク炉であれば、 CO: やH: Oがガス状として、炉外へ逃げることがで き、熱架構反応が経時的に進み、平坦化が抑制される。

【0017】また、ペーク温度を上げて行くと、さらに 50 熱架橋反応が促進されることになり、同様に平坦化が抑

制される結果となる。逆に、ペーク温度を下げた場合に は、熱架橋反応は抑制されるが、樹脂自身の熱溶融性も 小さいため、平坦化は向上しない。

【0018】しかし、密閉されたペーク炉で、加圧下で ペークを行った場合、CO』やH』Oがガス状として、 外部へ逃げることができず、CO2 やH2 Oの発生が抑 制され、結果として、熱架橋反応が抑制されることにな る。また、ベーク温度を上げて行くと、熱架橋反応が抑 制されるため、熱溶融性のみが大きくなり(一般に、液 り一層促進される。

【0019】以上述べたようにして、形成した平坦化膜 4を多層レジストプロセスの下層膜として使用する場合 には、この平坦化膜4を硬化させる必要がある。そこ で、次に、図1(d) に示すように、密閉されたベーク炉 3内を0.5 torrの真空下で、ヒータ3 a により、200 ℃5分のペークを行ったところ、樹脂からCO2 やH2 〇のガス状での発生が促進され、熱架橋反応を促進する ことができ、オープンペーク炉による熱硬化よりも速く 熱硬化した良好な平坦化膜5を形成することができる。

【0020】次に、この発明の第2の発明の実施例とし て、加圧時の密閉されたペーク炉3内の雰囲気は、空気 よりも、COzやHzOにして、加圧した方が熱架橋反 応はより抑制され、平坦化を向上させることができる。

【0021】さらに、第3の実施例として、雰囲気をガ

ス状のECA (エチルセルゾルプアセテート) 溶剤にし て加圧した場合には、熱溶融性がより促進され、平坦化 を向上させることができ、CO2, H2O, 溶剤を混合 した雰囲気下でも、同様の効果を発揮する。

[0022]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、この発明 によれば、段差を有する基板上に熱溶融性の大きい樹脂 を例えば回転塗布することにより形成した塗布膜を密閉 されたペーク炉内において、加圧下でペークを行うよう 体の熱粘性は温度を上げると小さくなる)、平坦化がよ 10 にしたので、熱架橋反応を抑制し、熱溶融反応を促進す ることになり、オープンペーク炉を使用するときよりも 良好な平坦化膜を形成できるという効果を奏する。ま た、この平坦化膜を熱硬化させるために、真空下でペー クを行っているので、熱架橋反応を促進し、オープンペ 一ク炉を使用したときよりも、速く熱硬化した良好な平 坦化膜を形成できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

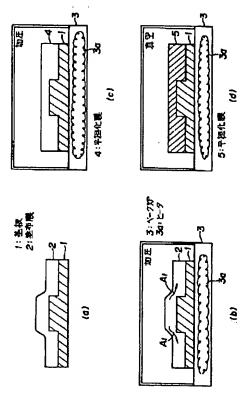
【図1】この発明のレジスト平坦化方法の一実施例の工 程説明図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 蛰布膜
- 3 ペーク炉
- 3a ヒータ
- 4, 5 平坦化膜

(図 |)

本形明 / I 社 說明 图



【手続補正書】 【提出日】平成4年5月14日 【手続補正1】 【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【補正内容】

[図1]

本形明の工程説明图

